ľ,

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-015851

(43)Date of publication of application: 17.01.1997

(51)Int.CI.

G03F 7/022 CO8L 61/06 GO3F 7/023 H01L 21/027

(21)Application number: 07-167529

(71)Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

03.07.1995

(72)Inventor:

TAN SHIRO

KAWABE YASUMASA

#### (54) POSITIVE TYPE PHOTORESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a composition having high resolution, wide defocus latitude, and heat resistance and also having sufficient deep UV curing property by using a specified alkali-soluble novolak resin and a quinonediazide compound.

SOLUTION: This composition contains an alkali-soluble resin obtained by condensing a phenol compound represented by the formula I, formaldehyde, an aromatic aldehyde represented by the formula II and a 1,2quinonediazide compound. In the formulae, R1-R3, which may be the same or different, each represent hydrogen atom, a hydroxy group, a halogen atom, an alkyl group, a cycloalkyl group, an alkoxy group, an alkenyl group, an aryl group, an aralkyl group or the like. R4-R8, which may be the same or different, each represent hydrogen atom, a hydroxy group, a formyl group, a halogen atom, an alkyl group, a cycloalkyl group, an alkylene dioxy group mutually forming a ring or the like. However, at least two of R4-R8 are alkylenedioxy groups mutually forming a ring.

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

24.01.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3534208

[Date of registration]

19.03.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-15851

(43)公開日 平成9年(1997)1月17日

F
1

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 18 頁)

			— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(21)出願番号	特顏平7-167529	(71)出顧人	000005201
			宮士写真フイルム株式会社
(22)出顧日	平成7年(1995)7月3日		神奈川県南足柄市中沼210番地
		(72)発明者	丹 史郎
	•	·	静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
			真フイルム株式会社内
		(72)発明者	河辺 保雅
			静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
			真フイルム株式会社内
		(74)代理人	
		(/4/144)	741 X3 T (134)

# (54)【発明の名称】 ポジ型フォトレジスト組成物

# (57)【要約】

【課題】 高い解像度、広いデフォーカスラチチュード、耐熱性を有するとともに、Deep UV硬化性に富んだポジ型フォトレジスト組成物を提供する。

【解決手段】 特定のフェノール化合物と、ホルムアルデヒド及び特定の芳香族アルデヒド化合物とを縮合させて得られるアルカリ可溶性樹脂と、1,2ーキノンジアジド化合物とを含むことを特徴とするポジ型フォトレジスト化合物。

【特許請求の範囲】

下記一般式 (1) で示されるフェノール 【請求項1】 化合物と、ホルムアルデヒドおよび下記一般式 (2) で 示される芳香族アルデヒドを縮合させて得られるアルカ リ可溶性樹脂と、1,2ーキノンジアジド化合物を含む ことを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

【化1】

ここで、

R1~R3:同一でも異なっても良く、水素原子、水酸 基、ハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、ア ルコキシ基、アルケニル基、アリール基、アラルキル 基、アルコキシカルボニル基もしくはアリールカルボニ ル基、

R4~R8:同一でも異なっても良く、水素原子、水酸 基、ホルミル基、ハロゲン原子、アルキル基、シクロア ルキル基、アルコキシ基、アルケニル基、アリール基、 アラルキル基、互いに環を形成してなるアルキレンジオ キシ基、ただし、R4~R8のうち少なくとも2つは互い に環を形成してなるアルキレンジオキシ基である。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は輻射線に感応するポ ジ型フォトレジスト組成物に関するものであり、特に高 い解像力、広いデフォーカスラチチュード、高耐熱性を 30 備え、更にドライエッチング耐性を付与するためのDe ер UV硬化性に富んだ微細加工用フォトレジスト組 成物に関するものである。

【0002】本発明に成るポジ型フォトレジスト組成物 は、半導体ウエハー、ガラス、セラミツクスもしくは金 属等の基板上にスピン塗布法もしくはローラー塗布法で 0.5~3μmの厚みに塗布される。その後、加熱、乾 燥し、露光マスクを介して回路パターン等を紫外線照射 等により焼き付け、現像してポジ画像が形成される。更 にこのポジ画像をマスクとしてエツチングすることによ り、基板上にパターンの加工を施すことができる。代表 的な応用分野にはIC等の半導体製造工程、液晶、サー マルヘツド等の回路基板の製造、その他のフォドファブ リケーション工程等がある。

[0003]

【従来の技術】ポジ型フォトレジスト組成物としては、 一般にアルカリ可溶性樹脂(例えばノボラック樹脂)と 感光物としてのナフトキノンジアジド化合物とを含む組 成物が用いられている。感光物に用いるナフトキノンジ アジド化合物は、それ自身ノボラツク樹脂のアルカリ溶 50 高解像力を行するポジ型感光性レジストが得られること

解性を低下せしめる溶解阻止剤として作用するが、光照 射を受けて分解するとアルカリ可溶性物質を生じてむし ろノボラツク樹脂のアルカリ溶解度を髙める働きをする 点で特異であり、この光に対する大きな性質変化の故に ポジ型フォトレジストの感光物として特に有用である。 【0004】また、結合剤としてのノボラツク樹脂は、 膨潤することなくアルカリ水溶液に溶解可能であり、ま た生成した画像をエツチングのマスクとして使用する際 に特にプラズマエツチングに対して高い耐性を与えるが 10 故に本用途に特に有用である。例えば、「ノボラツク型 フエノール樹脂/ナフトキノンジアジド置換化合物」と してUSP-3,666,473号、USP-4,11 5, 128号及びUSP-4, 173, 470号等に、 また最も典型的な組成物として「クレゾールーホルムア ルデヒドより成るノボラツク樹脂/トリヒドロキシベン ゾフエノンー1, 2ーナフトキノンジアジドスルホン酸 エステル」の例がトンプソン「イントロダクシヨン・ト ウー・マイクロリソグラフイー」(L. F. Thomp son [Introduction to Micro lithography」) (ACS出版、No. 21 9号、P112~121) に記載されている。

【0005】また、特開平6-242601号公報に は、ノボラック樹脂としてフェノール性化合物(フェノ ール、mー/pークレゾール、キシレノール)と、芳香 族アルデヒド(ベンズアルデヒド、ヒドロキシベンズア ルデヒド)を含むアルデヒド類とを酸触媒の存在下で反 応させて得られる低分子量を単離せずに、更にフェノー ル類及びホルムアルデヒドと縮合させて得られるノボラ ック樹脂が記載されている。そして、このノボラック樹 脂にoーナフトキノンジアジド化合物を含有させること により、解像度、プロファイル、感度、焦点深度及び耐 熱性等の諸特性のバランスに優れ、しかもスカムのない 感光性樹脂組成物が得られることが記載されている。

【0006】また、USP-5,266,440号に は、芳香族アルデヒド類(ベンズアルデヒド、サリシル アルデヒド)と、フェノール類(フェノール、mー/p ークレゾール、キシレノール、ナフトール、ビスフェノ ール)と、必要に応じてホルムアルデヒドとの縮合物か らなるノボラック樹脂に、o-キノンジアジド化合物を 40 含有させたフォトレジスト組成物が記載されている。こ のフォトレジスト組成物は、耐熱性に優れるという特性 を有する。

【0007】また、特開平2-84414号公報には、 ノボラック樹脂として、フェノール性化合物(フェノー ル、m-/p-クレゾール)、ホルムアルデヒド及びモ ノヒドロキシ芳香族アルデヒドからなるノボラック樹脂 が記載されている。そして、ホルムアルデヒド及びモノ ヒドロキシ芳香族アルデヒドを含むアルデヒドの混合物 からノボラック樹脂が調製されることにより、耐熱性、

が記載されている。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】しかし、超LSIなどの半導体基板の製造においては1μm以下の線幅から成る超微細パターンの加工が必要とされる。かかる用途においては、特に高い解像力、デフォーカスラチチュードが広く高耐熱性、露光マスクの形状を正確に写しとる高いパターン形状再現精度及び高生産性の観点からの高感度を有するフォトレジストが要求され、従来の上記ポジ型フォトレジストでは対応できないのが実状である。

【0009】また、近年、スループット向上の観点からより厳しいドライエッチング条件が用いられるに至り、露光・アルカリ溶液現像して得られたレジストパターンを更に加熱しつつ遠紫外線を照射して硬化せしめる「Deep UV硬化法」が適用される傾向にある(例えば、遠藤政孝等、「ポジ型フォトレジストの遠紫外線照射効果とそのリソグラフィーへの応用」;高分子論文集、Vo1.45、No.10、pp.771-776(Oct.1988))。しかしながら、上記に挙げたような従来のフェノール、クレゾール、キシレノール主体のノボラック樹脂や、単に芳香族アルデヒドを用いて共縮合させたノボラック樹脂では、DeepUVによる硬化が不十分であった。

【0010】従って本発明の目的とする所は、特に半導体デバイスの製造において、(1)高い解像力を有するポジ型フォトレジスト組成物、(2)広いデフォーカスラチチュードを有するポジ型フォトレジスト組成物、

(3) 得られるレジスト像が耐熱性に優れるポジ型フォトレジスト組成物、(4) Deep UV硬化性に富んだポジ型フォトレジスト組成物を提供することにある。 【0011】

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記諸特性に留意し鋭意検討した結果、特定のアルカリ可溶性ノボラック樹脂とキノンジアジド化合物を用いることにより、上記目的を達成できることを見いだし、この知見に基づいて本発明を完成させるに到った。

【0012】即ち、本発明の目的は、下記構成により達成することができる。

(1) 下記一般式(1)で示されるフェノール化合物と、ホルムアルデヒドおよび下記一般式(2)で示される芳香族アルデヒドを縮合させて得られるアルカリ可溶性樹脂と、1,2ーキノンジアジド化合物を含むことを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

[0013]

【化2】

[0014] ここで、

R1~R3:同一でも異なっても良く、水素原子、水酸 基、ハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、ア ルコキシ基、アルケニル基、アリール基、アラルキル 基、アルコキシカルボニル基もしくはアリールカルボニ ル基、

 $R_4 \sim R_8$ : 同一でも異なっても良く、水素原子、水酸基、ホルミル基、ハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基、互いに環を形成してなるアルキレンジオキシ基、ただし、 $R_4 \sim R_8$ のうち少なくとも2つは互いに環を形成してなるアルキレンジオキシ基である。

【0015】即ち、本発明は、アルカリ可溶性樹脂として、下記一般式(1)で示されるフェノール化合物と、ホルムアルデヒド及び一般式(2)で示される芳香族アルデヒド化合物とを縮合して得られるアルカリ可溶性樹脂を用いることにより、高い解像力及び広いデフォーカスラチチュード、高耐熱性を有するとともに、ドライエッチング耐性を付与するためのDeepUV硬化性に優れたポジ型フォトレジストを提供することができる。

【0016】本発明に係るポジ型フォトレジスト組成物は、特に耐熱性が要求されるドライエッチング処理に好適に使用可能である。

0 【0017】以下、本発明を詳細に説明する。

【0018】上記一般式(1)のR1~R3において、ハ ロゲン原子としては塩素原子、臭素原子もしくは沃素原 子が好ましく、塩素原子がより好ましい。アルキル基と してはメチル基、エチル基、プロピル基、nーブチル 基、イソブチル基、sec-ブチル基もしくはt-ブチ ル基の様な炭素数1~4のアルキル基が好ましく、メチ ル基が感度の点でより好ましい。シクロアルキル基とし ては、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロへ プチル基、シクロオクチル基が好ましく、シクロヘキシ ル基がより好ましい。アルコキシ基としてはメトキシ 基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ 基、ヒドロキシプロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソプトキシ基、sec-ブトキシ基もし くは t ープトキシ基の様な炭素数 1~4のアルコキシ基 が好ましく、メトキシ基及びエトキシ基がより好まし い。アルケニル基としてはビニル基、プロペニル基、ア リル基もしくはプテニル基のような炭素数2~4のアル ケニル基が好ましく、ビニル基及びアリル基がより好ま しい。アリール基としてはフェニル基、キシリル基、ト 50 ルイル基もしくはクメニル基が好ましく、フェニル基が

より好ましい。

より好ましい。アラルキル基としてはベンジル基、フェ ネチル基もしくはクミル基が好ましく、ベンジル基がよ り好ましい。アルコキシカルボニル基としてはメトキシ カルボニル基もしくはエトキシカルボニル基が好まし く、メトキシカルボニル基がより好ましい。アリールカ ルボニル基としてはベンゾイルオキシ基が好ましい。 【0019】また、R1~R3は同一でもよく、異なって いてもよい。更に、各置換基の置換位置も特に限定され ない。

【0020】上記一般式(1)で示されるフェノール類 10 のより具体的な例としては、フェノール、oークレゾー ル、mークレゾール、pークレゾール等のクレゾール 類、2,5ーキシレノール、3,5ーキシレノール、 3, 4ーキシレノール、2, 4ーキシレノール、2, 6 ーキシレノール等のキシレノール類、oーエチルフェノ ール、mーエチルフェノール、pーエチルフェノール、 pーtーブチルフェノール等のアルキルフェノール類、 o-メトキシフェノール、m-メトキシフェノール、p ーメトキシフェノール、oーエキトシフェノール、mー エキトシフェノール、p-エキトシフェノール、3,5 ージメトキシフェノール、2ーメトキシー4ーメチルフ ェノール、oープロポキシフェノール、mープロポキシ フェノール、pープロポキシフェノール、oーブトキシ フェノール、mープトキシフェノール、pープトキシフ ェノール等のアルコキシフェノール類、oービニルフェ ノール、mービニルフェノール、pービニルフェノー ル、oーアリルフェノール、mーアリルフェノール、p -アリルフェノール等のアルケニルフェノール類、2, 3, 5ートリメチルフェノール、3, 4, 5ートリメチ ルフェノール、2,3,6ートリメチルフェノール等の トリメチルフェノール類、oーフェニルフェノール、m -フェニルフェノール、p-フェニルフェノール等のア リールフェノール類、o-ベンジルフェノール、m-ベ ンジルフェノール、pーベンジルフェノール等のアラル キルフェノール類、οーメトキシカルボニルフェノー ル、mーメトキシカルボニルフェノール、pーメトキシ カルボニルフェノール等のアルコキシカルボニルフェノ ール類、oーベンゾイルオキシフェノール、mーベンゾ イルオキシフェノール、pーベンゾイルオキシフェノー ル等のアリールカルボニルフェノール類、oークロロフ ェノール、mークロロフェノール、pークロロフェノー ル等のハロゲン化フェノール類、カテコール、レゾルシ ノール、ヒドロキノン、フロログルシノール、ピロガロ ール等のポリヒドロキシベンゼン類等を示すことができ るがこれらに限定されるものではない。

【0021】また、フェノール類のメチロール化物、例 えばビスヒドロキシメチルーpークレゾール等を用いる こともできる。

【0022】これらの中で、フェノール、クレゾール 類、キシレノール類、トリメチルフェノール類が好まし 50 用できる化合物はこれらに限定される訳ではない。

く、mークレゾール、pークレゾール、oークレゾー ル、2、3-キシレノール、2、5-キシレノール、 3, 5-キシレノール、2, 6-キシレノール、3, 4 ーキシレノール、2、3、5ートリメチルフェノールが

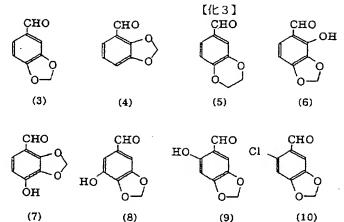
【0023】更に、一般式(1)のフェノール化合物と しては、2,3ーキシレノール又は3,5ーキシレノー ルと他のフェノール化合物との併用が好ましい。また例 えば、特開平5-181270号、特開平5-3236 04号、特開平5-249666号、特開平5-232 696号、特開昭60-164740号、特開平5-3 23605号、特開平4-226458号、特開平5-188590号及び特開平7-72623号等各公報に 記載されている2~5個の芳香環を有するポリフェノー ル類と併用することができる。さらに2、2′ージヒド ロキシー5,5'ージメチルジフェニルメタンを好適に 用いることができる。 上記キシレノール又はこれらポ リフェノール類の併用比率は、一般式(1)のフェノー ル化合物に対して30モル%以下、好ましくは20モル %以下であることが好ましい。

【0024】上記一般式(2)のR4~R8において、ハ ロゲン原子としては塩素原子、臭素原子もしくは沃素原 子が好ましく、塩素原子がより好ましい。アルキル基と してはメチル基、エチル基、プロピル基、nーブチル 基、イソブチル基、secーブチル基もしくはtーブチ ル基の様な炭素数1~4のアルキル基が好ましく、メチ ル基が感度の点でより好ましい。シクロアルキル基とし ては、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロへ プチル基、シクロオクチル基が好ましく、シクロヘキシ ル基がより好ましい。アルコキシ基としてはメトキシ 基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ 基、ヒドロキシプロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、secーブトキシ基もし くはtープトキシ基の様な炭素数1~4のアルコキシ基 が好ましく、メトキシ基及びエトキシ基がより好まし い。アルケニル基としてはビニル基、プロペニル基、ア リル基もしくはブテニル基の様な炭素数2~4のアルケ ニル基が好ましく、ビニル基及びアリル基がより好まし い。アリール基としてはフェニル基、キシリル基、トル イル基もしくはクメニル基が好ましく、フェニル基がよ り好ましい。アラルキル基としてはベンジル基、フェネ チル基もしくはクミル基が好ましく、ベンジル基がより 好ましい。互いに環を形成してなるアルキレンジオキシ 基としては、メチレンジオキシ基、エチレンジオキシ基 が好ましい。但し、R4~R8のうち少なくとも2つは互 いに環を形成してなるアルキレンジオキシ基である必要 がある。なお置換位置は特に制限されない。

【0025】一般式(2)で示される芳香族アルデヒド 類のより具体的な例を以下に示すが、本発明において使

الرائدان والمتعارف ومرهوا وبالأحساط فالمام والإرارة

6]



\*下であることが好ましく、0.1~30モル%未満がさらに好ましい。

【0028】本発明の効果を十分に発揮するフェノール 類混合物と一般式(2)で示される芳香族アルデヒド類 との特に好ましい組み合わせと、その好ましい混合比を いてにこれ

mークレゾール

30モル%以上 90モル%未満

2, 3ーキシレノール;

;

10モル%以上 70モル%未満

芳香族アルデヒド ;

0. 1モル%以上 40モル%未満

しくは、

m-クレゾール ; 30モル%以上 80モル%未満 2,3-キシレノール; 20モル%以上 70モル%未満

芳香族アルデヒド ; 1モル%以上 30モル%未満

m-クレゾール : 30モル%以上 90モル%未満

3. 5-キシレノール; 10モル%以上 70モル%未満

芳香族アルデヒド ; 0.1モル%以上 40モル%未満

しくは、

mークレゾール : 30モル%以上 80モル%未満

3. 5-キシレノール; 20モル%以上 70モル%未満

芳香族アルデヒド : 1モル%以上 30モル%未満

mークレゾール ; 30モル%以上 90モル%未満

pークレゾール ; 1モル%以上 5モル%未満

2. 3-キシレノール; 10モル%以上 70モル%未満

芳香族アルデヒド ; 0.1モル%以上 40モル%未満

しくは、

m-クレゾール ; 30モル%以上 80モル%未満

p-クレゾール ; 1モル%以上 5モル%未満

2,3-キシレノール; 20モル%以上 70モル%未満

芳香族アルデヒド ; 1モル%以上 30モル%未満

- クレゾールを含まない系としては、以下に示 【0029】

りせが好ましい。

2, 2' -ジヒドロキシー5, 5' -ジメチルジフェニルメタン;

1 モル%以上 3 0 モル%未満

oークレゾール ; 1モル%以上 20モル%未満

2. 3ーキシレノール: 40モル%以上 80モル%未満

2,6ーキシレノール: 3 モル%以上 2 0 モル%未満

2, 3, 5ートリメチルフェノール:

5 モル%以上 4 0 モル%未満

芳香族アルデヒド類 ; 1 モル%以上 3 0 モル%未満

より好ましくは

2, 2'ージヒドロキシー5, 5'ージメチルジフェニルメタン;

3モル%以上 20モル%未満

o-クレゾール 1 モル%以上 1 0 モル%未満 2, 3ーキシレノール; 40モル%以上 80モル%未満

2,6ーキシレノール; 3 モル%以上 20モル%未満

2, 3, 5ートリメチルフェノール;

# 芳香族アルデヒド類 :

【0030】本発明においては、更にホルムアルデヒド を必須成分として含み、その使用量は、一般式(1)で 示されるフェノール類100モル%に対して20~15 0モル%であることが好ましく、50~120モル%が 更に好ましい。尚、ホルムアルデヒドはホルムアルデヒ 等の形態で用いることもできる。更に第3成分として、 アセトアルデヒド、フルフラール、ベンズアルデヒド、 ヒドロキシベンズアルデヒド類、クロトンアルデヒド、 クロロアセトアルデヒド等を使用することもできる。

【0031】縮合反応に用いる酸性触媒としては塩酸、 硫酸、ギ酸、酢酸、pートルエンスルホン酸及びシュウ 酸等を使用することができ、中でもシュウ酸およびpー トルエンスルホン酸が好ましい。また、これらを併用し て用いることもできる。

【0032】本発明の上記成分からなるノボラツク樹脂 30 の重量平均分子量は、3000~2000、好ましく は4000~18000、より好ましくは5000~1 6000の範囲であることが好ましい。3000未満で は未露光部の現像後の膜減りが大きく、20000を超 えると現像速度が小さくなって感度が低下してしまう。 本発明のノボラック樹脂は低分子量成分を除去し、除去 した後の分子量が上記範囲にあるとき、最も効果を発揮 する。ノボラック樹脂の低分子量成分の除去方法として は、特開昭60-45238、同60-97347、同 14229、特開平1-276131、同2-6091 5、同2-275955、同2-282745、同4-101147、同、4-122938等の公報に記載さ れている技術、例えば分別沈澱、分別溶解、カラムクロ マトグラフィー等の方法により除去すると、スカム、耐 熱性等の性能が向上するので更に好ましい。除去する低 分子量成分の量は20重量%~70重量%が好ましく、 30重量%~60重量%が更に好ましい。

【0033】ここで、重量平均分子量はゲルパーミエー

5モル%以上 30モル%未満 1 モル%以上 20モル%未満

をもって定義される。また、ノボラック樹脂の分散度 (重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnの比、即ちM w/Mn)は1.5~4.0、好ましくは1.8~3. 5、更に好ましくは2.0~3.3である。4を越える と感度、耐熱性、プロファイル等の性能が損なわれる。 ド前駆体、即ち、パラホルムアルデヒド、トリオキサン 20 他方、1.5未満ではノボラック樹脂を合成する上で高 度の精製工程を要するので、実用上の現実性を欠き不適 切である。

> 【0034】併用可能なアルカリ可溶性樹脂は、ノボラ ック樹脂と相溶すれば特に限定されないが、ポリヒドロ キシスチレン、アセトンーピロガロール樹脂、アセトン ーレゾルシン樹脂等が耐熱性を劣化させないので好まし

【0035】本発明では、感光物として1,2-キノン ジアジド化合物、特に1,2ーナフトキノンジアジドス ルホニルエステル類を用いるが、これらは、以下に示す ポリヒドロキシ化合物と1,2ーナフトキノンジアジド -5-(及び/又は-4-)スルホニルクロリドとを、 塩基性触媒の存在下で、エステル化することにより得ら れる。

【0036】ポリヒドロキシ化合物の例としては、2, 3, 4ートリヒドロキシベンゾフエノン、2, 4, 4' ートリヒドロキシベンゾフエノン、2,4,6ートリヒ ドロキシベンゾフエノン、2,3,4-トリヒドロキシ -2'-メチルベンゾフエノン、2,3,4,4'-テ 60-140235、同60-189739、同64- 40 トラヒドロキシベンゾフエノン、2,2',4,4'-テ トラヒドロキシベンゾフエノン、2,4,6,3',4' ーペンタヒドロキシベンゾフエノン、2,3,4,2', 4'ーペンタヒドロキシベンゾフエノン、2,3,4, 2',5' ーペンタヒドロキシベンゾフエノン、2,4, 6, 3', 4', 5' ーヘキサヒドロキシベンゾフェノン、 2, 3, 4, 3', 4', 5' ーヘキサヒドロキシベンゾフ エノン等のポリヒドロキシベンゾフエノン類、

【0037】2、3、4ートリヒドロキシアセトフェノ ン、2,3,4ートリヒドロキシフエニルペンチルケト シヨンクロマトグラフイー(GPC) のポリスチレン換算値 50 ン、2,3,4ートリヒドロキシフエニルヘキシルケト

11

ン等のポリヒドロキシフエニルアルキルケトン類、

【0038】 ビス(2,4-ジヒドロキシフエニル)メ タン、ビス(2,3,4-トリヒドロキシフエニル)メ タン、ビス(2,4-ジヒドロキシフエニル)プロパン -1、ビス(2, 3, 4-トリヒドロキシフエニル)プ ロパンー1、ノルジヒドログアイアレチン酸等のビス ((ポリ)ヒドロキシフエニル)アルカン類、

【0039】3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸プロ ピル、2,3,4ートリヒドロキシ安息香酸フエニル、 3, 4, 5ートリヒドロキシ安息香酸フエニル等のポリ 10 ソオール、3, 3, 3, 3, 6 ーテトラメチルー1, 1 ヒドロキシ安息香酸エステル類、

【0040】ビス(2,3,4ートリヒドロキシベンゾ イル) メタン、ビス(3-アセチル-4,5,6-トリ ヒドロキシフエニル)ーメタン、ビス(2,3,4ート リヒドロキシベンゾイル) ベンゼン、ビス(2,4,6 ートリヒドロキシベンゾイル) ベンゼン等のビス (ポリ ヒドロキシベンゾイル) アルカン又はビス (ポリヒドロ キシベンゾイル)アリール類、

【0041】エチレングリコールージ(3,5ージヒド ロキシベンゾエート)、エチレングリコールージ(3, 4, 5-トリヒドロキシベンゾエート) 等のアルキレン ージ(ポリヒドロキシベンゾエート)類、

【0042】2、3、4ービフエニルトリオール、3、 4, 5-ビフエニルトリオール、3, 5, 3',5' ービ フエニルテトロール、2,4,2',4'ービフエニルテ トロール、2, 4, 6, 3',5' ーピフエニルペントー ル、2, 4, 6, 2', 4', 6' ービフエニルヘキソー ル、2,3,4,2', 3',4' ービフエニルヘキソー ル等のポリヒドロキシビフエニル類、

シ) ベンゼン等のビス (ポリヒドロキシ) スルフイド 類、

【0044】2,2',4,4'ーテトラヒドロキシジフ エニルエーテル等のビス(ポリヒドロキシフエニル)エ ーテル類、

【0045】2,2',4,4'ーテトラヒドロキシジフ エニルスルフオキシド等のビス(ポリヒドロキシフエニ ル)スルフオキシド類、

【0046】2,2',4,4'ージフエニルスルフオン 等のビス(ポリヒドロキシフエニル)スルフオン類、 【0047】トリス(4ーヒドロキシフェニル)メタ ン、4,4',4"ートリヒドロキシー3,5,3',5' ーテトラメチルトリフェニルメタン、4, 4',3'', 4''-テトラヒドロキシー3, 5, 3',5' ーテトラメ チルトリフエニルメタン、4,4',2'',3'',4''-ペンタヒドロキシー3, 5, 3',5' ーテトラメチルト リフエニルメタン、2, 3, 4, 2',3',4' -へキサ ヒドロキシー5, 5' ージアセチルトリフエニルメタ ン、2,3,4,2',3',4',3'',4''ーオクタヒド ロキシー5, 5'ージアセチルトリフエニルメタン、

12

2, 4, 6, 2', 4', 6' ーヘキサヒドロキシー5, 5′ージプロピオニルトリフエニルメタン等のポリヒドー ロキシトリフエニルメタン類、

1'ースピロビーインダンー5, 6,5',6'ーテトロ ール、3,3',3'ーテトラメチルー1,1'ース ピロビーインダン-5,6,7,5',6',7' -ヘキソ オール、3,3',3'ーテトラメチルー1,1'ー スピロビーインダンー4, 5, 6, 4',5',6' ーヘキ -スピロビーインダン-4, 5, 6, 5', 6', 7' -へ キソオール等のポリヒドロキシスピロビーインダン類、 【0049】3、3ービス(3、4ージヒドロキシフエ ニル) フタリド、3, 3ービス(2, 3, 4ートリヒド ロキシフエニル) フタリド、3',4',5',6' ーテトラ ヒドロキシスピロ「フタリドー3、9'ーキサンテン 等のポリヒドロキシフタリド類、

【0050】モリン、ケルセチン、ルチン等のフラボノ 色素類、

【0051】 $\alpha$ ,  $\alpha$ ',  $\alpha$ " ートリス(4ーヒドロキシ フエニル) 1, 3, 5-トリイソプロピルベンゼン、 ロキシフエニル) 1, 3, 5-トリイソプロピルベンゼ ン、 $\alpha$ ,  $\alpha$ ',  $\alpha$ "ートリス(3, 5ージエチルー4ー ヒドロキシフエニル) 1, 3, 5-トリイソプロピルベ ンゼン、 $\alpha$ ,  $\alpha$ ',  $\alpha$ "ートリス(3, 5ージnープロ ピルー4ーヒドロキシフエニル) 1, 3, 5ートリイソ プロピルベンゼン、 $\alpha$ ,  $\alpha$ ',  $\alpha$ " -トリス(3, 5-ジイソプロピルー4ーヒドロキシフエニル) 1, 3, 5 【0.043】4, 4' ーチオビス(1, 3ージヒドロキ 30 ートリイソプロピルベンゼン、 $\alpha$ ,  $\alpha'$ ,  $\alpha''$  ートリス (3, 5-ジn-ブチルー4-ヒドロキシフエニル) 1. 3. 5-トリイソプロピルベンゼン、α. α', α"ートリス(3ーメチルー4ーヒドロキシフエニル) α"-トリス(3-メトキシ-4-ヒドロキシフエニ ル) 1, 3, 5ートリイソプロピルベンゼン、α,  $\alpha'$ ,  $\alpha''$  - トリス (2, 4 - ジヒドロキシフエニル) 1, 3, 5ートリイソプロピルベンゼン、1, 3, 5ー トリス(3,5ージメチルー4ーヒドロキシフエニル) 40 ベンゼン、1、3、5ートリス(5ーメチルー2ーヒド ロキシフエニル) ベンゼン、2、4、6-トリス(3、 5-ジメチルー4-ヒドロキシフエニルチオメチル)メ シチレン、 $1-[\alpha-メチル-\alpha-(4'-ヒドロキシ$ フエニル) エチル] -4-[α, α'-ビス(4"-ヒ ドロキシフエニル) エチル] ベンゼン、1-[α-メチ ルーαー(4'ーヒドロキシフエニル)エチル]-3- $[\alpha, \alpha' - \forall \lambda (4" - \forall \lambda ) ]$ ル] ベンゼン、 $1-[\alpha-メチル-\alpha-(3',5'-$ ジメチルー4'ーヒドロキシフエニル)エチル]ー4ー 50 [α, α' -ビス (3", 5" -ジメチルー4" -ヒド ロキシフエニル)エチル]ベンゼン、 $1-[\alpha-x]$ ルー $\alpha-(3)$  ーメチルー4 ーヒドロキシフエニル)エチル]ー $4-[\alpha]$  、 $\alpha$  ービス(3 ーメチルー4 ーヒドロキシフエニル)エチル]ベンゼン、 $1-[\alpha-x]$  チルー $\alpha$  ー  $\alpha$  ・  $\alpha$  ・

【0052】pービス(2,3,4ートリヒドロキシベ ンゾイル) ベンゼン、pービス(2,4,6-トリヒド ロキシベンゾイル) ベンゼン、m-ビス(2,3,4-トリヒド ロキシベンゾイル) ベンゼン、m-ビス (2, 4, 6-トリヒドロキシベンゾイル) ベンゼン、 pービス(2,5-ジヒドロキシー3-ブロムベンゾイ ル) ベンゼン、pービス(2,3,4-トリヒドロキシ -5-メチルベンゾイル)ベンゼン、p-ビス(2, 3, 4ートリヒドロキシー5ーメトキシベンゾイル) ベ ンゼン、pービス(2,3,4-トリヒドロキシ-5-ニトロベンゾイル) ベンゼン、p-ビス(2,3,4-トリヒドロキシー5ーシアノベンゾイル)ベンゼン、 1, 3, 5ートリス(2, 5ージヒドロキシベンゾイ ル) ベンゼン、1,3,5-トリス(2,3,4-トリ ヒドロキシベンゾイル)ベンゼン、1,2,3-トリス (2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾイル) ベンゼン、 1, 2, 4ートリス(2, 3, 4ートリヒドロキシベン ゾイル) ベンゼン、1,2,4,5-テトラキス(2, 3, 4-トリヒドロ キシ ベンゾイル) ベンゼン、  $\alpha$ ,  $\alpha'$  - $\forall$   $\lambda$  (2, 3, 4- $\lambda$ )  $\lambda$  - $\lambda$ 

14

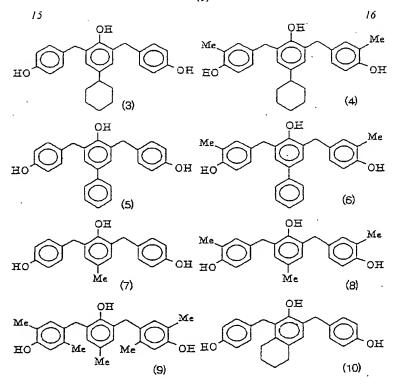
4-トリヒドロキシベンゾイル) メシチレン、 【0053】2,6-ビス-(2'-ヒドロキシー 3', 5'ージメチルーベンジル)ーpークレゾール、 2, 6-ビスー(2'-ヒドロキシー5'-メチルーベ ンジル) -p-クレゾール、2,6-ビス-(2'-ヒ ドロキシー3', 5'ージーtーブチルーベンジル)ー pークレゾール、2,6-ビス-(2'-ヒドロキシー 5' ーエチルーベンジル) -p-クレゾール、2,6-ビスー(2', 4'ージヒドロキシーベンジル)ーロー クレゾール、2,6ービスー(2'ーヒドロキシー3' -t-ブチル-5'-メチル-ベンジル)-p-クレゾ ール、2, 6-ビス-(2', 3', 4'-トリヒドロ キシー5'ーアセチルーベンジル)ーロークレゾール、 2, 6-ビスー(2', 4', 6'-トリヒドロキシー ベンジル)ーpークレゾール、2,6-ビスー(2', 3', 4'ートリヒドロキシーベンジル)ーpークレゾ ール、2, 6ービスー(2', 3', 4'ートリヒドロ キシーベンジル) -3, 5-ジメチルーフエノール、 4, 6-ビスー(4'-ヒドロキシー3', 5'-ジメ 20 チルーベンジル)ーピロガロール、4,6ービスー (4'-ヒドロキシー3', 5'-ジメトキシーベンジ ル)ーピロガロール、2,6ービスー(4'ーヒドロキ シー3', 5'ージメチルーベンジル)ー1, 3, 4-トリヒドロキシーフエノール、4,6-ビス-(2). 4', 6'ートリヒドロキシーベンジル)ー2.4ージ メチルーフエノール、4,6-ビスー(2',3', 4'ートリヒドロキシーベンジル)-2,5-ジメチル ーフエノール等を挙げることができる。

【0054】また、ノボラック樹脂等フエノール樹脂の 30 低核体を用いる事もできる。

【0055】更に、以下に示すポリヒドロキシ化合物を 用いることもできる。

[0056]

【化4】



[0057]

【0058】前記感光物のエステル化反応は、所定量のポリヒドロキシ化合物と、1,2ーナフトキノンジアジドー5ー(及び/叉はー4ー)スルホニルクロリドとをジオキサン、アセトン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、Nーメチルピロリドン、クロロホルム、トリクロロエタン、トリクロロエチレンあるいはジクロエタン等の溶媒に溶かし、塩基性触媒、例えば水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、ドリエチルアミン、Nーメチルモルホリン、Nーメチルピペラジン、4ージメチルアミノピリジン等を滴下して縮合させる。得られた生成物は、水洗後精製し乾燥する。

【0059】通常のエステル化反応においては、エステル化数及びエステル化位置が種々異なる混合物が得られるが、合成条件叉はポリヒドロキシ化合物の構造を選択することにより、ある特定の異性体のみを選択的にエステル化させることもできる。本発明でいうエステル化率は、この混合物の平均値として定義される。

【0060】このように定義されたエステル化率は、原料であるポリヒドロキシ化合物と1,2ーナフトキノンジアジド-5-(及び/又は-4-)スルホニルクロリドとの混合比により制御できる。即ち、添加された1,

30 2ーナフトキノンジアジドー5ー(及び/又はー4ー) スルホニルクロリドは、実質上総てエステル化反応を起 こすので、所望のエステル化率の混合物を得るために は、原料のモル比を調整すれば良い。

【0061】必要に応じて、1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニルクロリドと<math>1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホニルクロリドとを併用することもできる。また、前記方法における反応温度は、通常<math>-20 $\sim60$  $^{\circ}$ C、好ましくは $0\sim40$  $^{\circ}$ Cである。

【0062】前記のような方法で合成される感光性化合物は、樹脂組成物として使用する際に、単独でもしくは2種以上混合してアルカリ可溶性樹脂に配合して使用されるが、その配合量は、ノボラツク樹脂100重量部に対し該化合物5~150重量部、好ましくは20~100重量部である。この使用比率が5重量部未満では残膜率が著しく低下し、また150重量部を越えると感度及び溶剤への溶解性が低下する。

【0063】本発明の組成物には、更に現像液への溶解促進のために、ポリヒドロキシ化合物を含有することができる。好ましいポリヒドロキシ化合物としては、フェ 50 ノール類、レゾルシン、フロログルシン、2.3.4-

フエノン、2,3,4,4'一テ `フエノン、2,3,4,3', ドロキシベンゾフエノン、アセト 樹脂、フロログルシド、2,4, ルテトロール、4,4'ーチオビ キシ)ベンゼン、2,2',4, シジフエニル エーテル、2, ラヒドロキシジフエニルスルフオ , 4'ーテトラヒドロキシジフエ ス(4ーヒドロキシフェニル)メ 4ーヒドロキシフェニル)シクロ (α-メチルベンジリデン) ビス α" ートリス (4ーヒドロキシフ ートリイソプロピルベンゼン、 (4-ヒドロキシフェニル)-1 'ロピルベンゼン、1, 2, 2ート ニル) プロパン、1, 1, 2ート ・ルー4ーヒドロキシフェニル)プ 5ーテトラキス(4ーヒドロキシ 1, 2ーテトラキス(4ーヒドロ 、1、1、3-トリス(ヒドロキ パラ  $[\alpha, \alpha, \alpha', \alpha', -テト$ ・シフェニル)]ーキシレン等を挙

ポリヒドロキシ化合物は、キノン 重量部に対して、通常100重量 ~70重量部以下の割合で配合す

感光物及びアルカリ可溶性ノボラ 溶剤としては、エチレングリコー 、エチレングリコールモノエチル ソルブアセテート、エチルセロソ チレングリコールモノメチルエー コールモノエチルエーテル、プロ ・ルエーテルアセテート、プロピレ エーテルアセテート、トルエン、 ・ルケトン、シクロヘキサノン、2 ン酸エチル、2-ヒドロキシー2 エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒ 2-ヒドロキシー3-メチルブタ キシプロピオン酸メチル、3ーメ チル、3-エトキシプロピオン酸 プロピオン酸メチル、ピルビン酸 チル、酢酸エチル、酢酸ブチル、 モノメチルエーテルプロピオネー きる。これらの有機溶剤は単独 み合わせで使用される。

ーメチルホルムアミド、N. N-、Nーメチルアセトアミド、N,

メチルスルホキシド、ベンジルエチルエーテル等の高沸 点溶剤を混合して使用することができる。

20

【0067】本発明のポジ型フオトレジスト用組成物に は、ストリエーション等の塗布性を更に向上させるため に、界面活性剤を配合する事ができる。界面活性剤とし ては、例えばポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポ リオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチ レンセチルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエー テル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリ オキシエチレンオクチルフエノールエーテル、ポリオキ シエチレンノニルフエノールエーテル等のポリオキシエ チレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシエチレン ・ポリオキシプロピレンブロックコポリマー類、ソルビ タンモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート、ソ ルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエー ト、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリステア レート等のソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエ チレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレン ソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレンソル ビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタ ントリオレエート、ポリオキシエチレンソルビタントリ ステアレート等のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸 エステル類等のノニオン系界面活性剤、エフトツプEF 301, EF303, EF352 (新秋田化成(株) 製)、メガフアツクF171、F173 (大日本インキ (株)製)、フロラードFC430, FC431 (住友 スリーエム(株)製)、アサヒガードAG710,サー フロンS-382, SC101, SC102, SC10 3, SC104, SC105, SC106 (旭硝子( 株) 製) 等のフツ素系界面活性剤、オルガノシロキサン ポリマーKP341 (信越化学工業(株)製)やアクリ ル酸系もしくはメタクリル酸系(共)重合ポリフローN o. 75, No. 95 (共栄社 油脂化学工業(株) 製) 等を挙げることができる。これらの界面活性剤の配 合量は、本発明の組成物中のアルカリ可溶性樹脂及びキ ノンジアジド化合物 100 重量部当たり、通常、2重量 部以下、好ましくは1重量部以下である。

【0068】これらの界面活性剤は単独で添加してもよ いし、また、いくつかの組み合わせで添加することもで きる。

【0069】本発明のポジ型フオトレジスト組成物用の 現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、 炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリ ウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミ ン、nープロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルア ミン、ジーnープチルアミン等の第二アミン類、トリエ チルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、 ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等の アルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロ `ミド、Nーメチルピロリドン、ジ 50 キシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリ

ン等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピペリジン等の環状アミン類、等のアルカリ類の水溶液を使用することができる。更に、上記アルカリ類の水溶液にイソプロピルアルコール等のアルコール類、ノニオン系界面活性剤等の界面活性剤を適当量添加して使用することもできる。

【0070】本発明のポジ型フオトレジスト組成物に は、必要に応じ、吸光剤、架橋剤、接着助剤等を配合す ることができる。吸光剤は、基板からのハレーションを 防止する目的や透明基板に塗布した際の視認性を髙める 目的で、必要に応じて添加される。例えば、「工業用色 素の技術と市場」(СМС出版)や、染料便覧(有機合 成化学協会編)に記載の市販の吸光剤、例えば、C.I.De sperse Yellow 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 23, 31, 49, 50, 51, 54, 56, 60,64,66,68,79,82,88,90,93,102,114及び124 、C.I.Di sperse Orange 1, 5, 13, 25, 29, 30, 31, 44, 57, 72 及び73、 C. I. Disperse Red1, 5, 7, 13, 17, 19, 43, 50, 54, 58, 65, 72, 7 3,88,117,137,143,199 及び210 、C.I.Disperse Violet 43、C. I. Disperse Blue 96、C. I. Fluorescent Brighte ning Agent 112, 135及び163 、C.I. Solvent Yellow 1 4,16,33 及び56、C.I.Solvent Orange 2 及び45、C.I. Solvent Red 1,3,8,23,24,25,27 及び49、C.I.Pigment Green 10、C.I. Pigment Brown 2 等を好適に用いること ができる。吸光剤は通常、アルカリ可溶性樹脂100重 量部に対し、100重量部以下、好ましくは50重量部 以下、更に好ましくは30重量部以下の割合で配合され る。

【0071】架橋剤は、ポジ画像を形成するのに影響の無い範囲で添加される。架橋剤の添加の目的は、主に、感度調整、耐熱性の向上、耐ドライエッチング性向上等である。架橋剤の例としては、メラミン、ベンゾグアナミン、グリコールウリル等にホルムアルデヒドを作用させた化合物、叉はそのアルキル変性物や、エポキシ化合物、アルデヒド類、アジド化合物、有機過酸化物、ヘキサメチレンテトラミン等を挙げることができる。これらの架橋剤は、感光剤100重量部に対して、10重量部未満、好ましくは5重量部未満の割合で配合できる。架橋剤の配合量が10重量部を超えると感度が低下し、スカム(レジスト残渣)が生じるようになり好ましくない。

【0072】接着助剤は、主に、基板とレジストの密着性を向上させ、特にエッチング工程においてレジストが剥離しないようにするための目的で添加される。具体例としては、トリメチルクロロシラン、ジメチルビニルクロロシラン、メチルジフェニルクロロシラン類、トリメチルジメチルクロロシラン等のクロロシラン類、トリメチルジメトキシシラン、ジメチルビニルエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン等のアルコキシシラン類、ヘキサメチルジシラザ

22
ン、N、N´ービス(トリメチルシリル)ウレア、ジメチルトリメチルシリルアミン、トリメチルシリルイミダーゾール等のシラザン類、ビニルトリクロロシラン、 yークロロプロピルトリメトキシシラン、 yーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン類、ベンゾトリアゾール、ベンゾイミダゾール、インダゾール、イミダゾール、2ーメルカプトベンズイミダゾール、2ーメルカプトベンズイミダゾール、カプトベンズオキサゾール、サカプトベンズオキサゾール、メルカプトピリミジン等の複素環状化合物や、1、1ージメチルウレア、1、3ージメチルウレア等の尿素、叉はチオ尿素化合物を挙げることができる。

【0073】これらの接着助剤は、アルカリ可溶性樹脂 100重量部に対し、通常10重量部未満、好ましくは 5重量部未満の割合で配合される。

【0074】上記ポジ型フオトレジスト用組成物を精密 集積回路素子の製造に使用されるような基板(例:シリコン/二酸化シリコン被覆、ガラス基板、ITO基板等 の透明基板等)上にスピナー、コーター等の適当な塗布 方法により塗布後プリベークして、所定のマスクを通し て露光し、必要に応じて後加熱(PEB:Post ExposureBak e)を行い、現像、リンス、乾燥することにより良好な レジストを得ることができる。本発明はPS版にも用い られる。

【0075】以下、本発明の実施例を示すが、本発明は これらに限定されるものではない。なお、%は、他に指 定のない限り、重量%を示す。

[0076]

#### 30 【実施例】

ノボラック樹脂の合成

m-クレゾール81.11g、p-クレゾール4.87g、2,3ーキシレノール86.13gおよびピペロナール22.52gを攪拌機、還流冷却管および温度計を取り付けた500mLの三つロフラスコに仕込み90℃で攪拌下、シュウ酸2水和物5.67gを添加した。30分後、浴温を130℃に上げ、更に8.5時間攪拌し内

(1) ノボラック樹脂(a-1) の合成

容物をリフラックスさせた。次いで、ホルマリン水溶液 (37.32%) 120.70gを30分かけて滴下させた。反応混合物を更に4時間リフラックスさせた。

【0077】次いで、3-エトキシプロピオン酸エチル40gを添加した後、還流冷却管をリービッヒコンデンサーに取り替え、浴温を約1時間かけて200℃まで上げ、未反応のホルマリン、水等を除去した。更に1時間常圧留去を行った後、徐々に1mmHgまで減圧して未反応のモノマー等を留去した。減圧留去には2時間を要した

【0078】溶融したアルカリ可溶性ノボラック樹脂を 50 室温に戻して回収した。得られたノボラック樹脂の重量

平均分子量は5120(ポリスチレン換算)であった。このノボラック樹脂100gを1000gのアセトンに溶解し、攪拌下nーヘキサン1000gを添加して更に室温下30分攪拌の後、1時間静置した。上層をデカンテーション除去した後、残った下層をロータリーエバポレーターを用いて溶媒を留去し固形ノボラック(aー1)を得た。得られたノボラック樹脂(a-1)の重量平均分子量は10790(ポリスチレン換算)、分散度は2.6であった。

(2) ノボラック樹脂(a-2) の合成 m-クレゾール81.11g、p-クレゾール4.87g、2,3-キシレノール86.13g、ピペロナール 22. 52gおよびホルマリン水溶液(37.32%) 30.12gを攪拌機、還流冷却管および温度計を取り 付けた500mLの三つロフラスコに仕込み90℃で攪拌 下、シュウ酸2水和物5.67gを添加した。30分 後、浴温を130℃に上げ、更に12.5時間攪拌し内 容物をリフラックスさせた。次いで、ホルマリン水溶液 (37.32%) 90.58gを30分かけて滴下させ た。反応混合物を更に4時間リフラックスさせた。次い で、3-エトキシプロピオン酸エチル40gを添加した 後、還流冷却管をリービッヒコンデンサーに取り替え、 浴温を約1時間かけて200℃まで上げ、未反応のホル マリン、水等を除去した。更に1時間常圧留去を行った 後、徐々に1mmHqまで減圧して未反応のモノマー等を留 去した。減圧留去には2時間を要した。

【0079】溶融したアルカリ可溶性ノボラック樹脂を室温に戻して回収した。得られたノボラック樹脂の重量平均分子量は5240(ポリスチレン換算)であった。このノボラック樹脂100gを1000gのアセトンに溶解し、規拌下nーへキサン1000gを添加して更に室温下30分攪拌の後、1時間静置した。上層をデカンテーション除去した後、残った下層をロータリーエバポレーターを用いて溶媒を留去し固形ノボラック(aー2)を得た。得られたノボラック樹脂(aー2)の重量平均分子量は11000(ポリスチレン換算)、分散度は2.6であった。

(3) ノボラック樹脂 (a-3) の合成 2, 3-キシレノール54.98gおよびピペロナール 45.04gを攪拌機、還流冷却管および温度計を取り 付けた 1000 mLの三つロフラスコに仕込み 90 Cで複拌下、p-hルエンスルホン酸 0.86 gを添加した。 -30 分後、浴温を 130 Cに上げ、更に 5 時間攪拌し内容物をリフラックスさせた。次いで、m-クレゾール 162.21 g、p-0 レゾール 9.73 g、2.3-キシレノール 117.28 g およびホルマリン水溶液(37.30%) 241.53 gを 30 分かけて滴下させた。反応混合物を更に 4 時間リフラックスさせた。次いで、3- エトキシプロピオン酸エチル 100 gを添加した後、浴温を 80 Cにさげた。反応混合物にイオン交換水 300 mLを加え攪拌、水洗およびデカンテーションを 30 回繰り返した。

24

【0080】次いで還流冷却管をリービッヒコンデンサーに取り替え、浴温を約1時間かけて200℃まで上げ、未反応のホルマリン、水等を除去した。更に1時間常圧留去を行った後、徐々に1mmHgまで減圧して未反応のモノマー等を留去した。減圧留去には2時間を要した。溶融したアルカリ可溶性ノボラック樹脂を室温に戻して回収した。得られたノボラック樹脂の重量平均分子量は4170(ポリスチレン換算)であった。

【0081】このノボラック樹脂100gを1000gのアセトンに溶解し、攪拌下nーへキサン1500gを添加して更に室温下30分攪拌の後、1時間静置した。上層をデカンテーション除去した後、残った下層をロータリーエバポレーターを用いて溶媒を留去し固形ノボラック(a-3)を得た。得られたノボラック樹脂(a-3)の重量平均分子量は8440(ポリスチレン換算)、分散度は2.5であった。

(4) ノボラック樹脂(a-4)~(a-10)の合成表! 記載のモノマーおよび芳香族アルデヒドを所定の重量仕込み、他は実施例(1) と同様に重合、分別を実施し、ノボラック樹脂(a-4)~(a-10) を得た。(表1中モノマー仕込みはモル比を表し、全モノマー仕込み量は計1. 5モルとした。

【0082】また、芳香族アルデヒドの仕込み量はモノマー仕込み量(1.5モル)に対するモル%で示した。)

[0083]

【表1】

25 表1 ノボラック樹脂(a-1~a-10)の合成

ノボラック 樹脂	モノマー*	モノマー 仕込み比	アルデヒド	アルデヒド 添加モル%	分子量	分別後の 分子量	分散度
a-1	m/p/2,3Xy	50/3/47	(а) СНО	10	5120	10790	2.6
a – 2	m/p/2,3Xy	50/3/47	(a)	10	5240	11000	2.6
a-3	m/p/2,3Xy	50/3/47	(a)	10	4170	8440	2.5
a-4	m/p/2,3Xy	60/20/20	(a)	15	6290	13180	2.8
a-5	m/2,3Xy	60/40	(a)	15	4730	9170	2.6
a-6	m/p/3,5Xy	60/3/37	(a)	10	3870	7390	2.5
a-7	m/p	50/50	(a)	10	5720	10010	2.6
a-8	m/p/2,3Xy	50/3/47	(p) CHO	10	4860	9880	2.6

\* m; m-クレゾール

p;p-クレゾール

2,3Xy; 2,3-キシレノール

2,5Xy; 2,5-キシレノール

[0084]

ノボラック樹脂(a-1~a-10)の合成(つづき)

ノボラック 樹脂	モノマー*	モノマー 仕込み比	アルデヒド	アルデヒド 添加モル%	分子量	分別後の 分子量	分散度
a-9	m/p/2,3Xy	50/3/47	(с) ОН ОН	10	5740	11270	2.7
a-10	m/p/2,3Xy	50/3/47	(d) CHO	10	5840	11560	2.7

【表2】

\* m;m-クレゾール

p;p-クレゾール

2,3Xy;2,3-キシレノール

2,5Xy; 2,5~キシレノール

2, 2'ージヒドロキシー5, 5'ージメチルジフェニ ルメタン14.27g、o-クレゾール5.41g、 2, 3-キシレノール198.53g、2, 3, 5-ト リメチルフェノール68.10g、2,6-キシレノー ル24.43gおよびピペロナール37.53gを攪拌 機、還流冷却管および温度計を取り付けた1Lの三つ口 フラスコに仕込み更に3-エトキシプロピオン酸エチル 50gを添加した。混合物を90℃で攪拌下、シュウ酸 2水和物 0. 4 6 gを添加した。1時間後、浴温を13 0℃に上げ、更に30時間攪拌し内容物をリフラックス 50 が180℃まで低下したところで乳酸エチル620gを

【0085】(5)ノボラック樹脂(a-11)の合成 40 させた。次いで、シュウ酸2水和物9. 46gを再度添 加した後、反応混合物を更に13時間リフラックスさせ た。次いで、ホルマリン水溶液 (37.30%) 24 5. 30gを添加し、130℃で12時間リフラックス させ、3-エトキシプロピオン酸エチル25gを添加し た。更に6時間リフラックスさせ再度3-エトキシプロ ピオン酸エチル25gを添加した。次に、 選流冷却管を リービッヒコンデンサーに取り替え、浴温を約1時間か けて200℃まで上げ、未反応のホルマリン、水等を留 去した。留去には3時間を要した。加熱を停止し、内温

徐々に滴下しノボラックの乳酸エチル溶液を得た。得られたノボラック樹脂 (a-11) の重量平均分子量は3430 (ポリスチレン換算)、分散度は2.3であった。

(6) ノボラック樹脂 (b-1)  $\sim$  (b-2) の合成表2記載のモノマーおよび芳香族アルデヒドを所定の重量仕込み、他は実施例 (1) と同様に重合、分別を実施し、ノボラック樹脂 (b-1)  $\sim$  (b-2) までを得 \*

\*た。(表2中モノマー仕込みはモル比を表し、全モノマー仕込み量は計1.5モルとした。

28

【0086】また、芳香族アルデヒドの仕込み量はモノマー仕込み量(1.5モル)に対するモル%で示した。)

【0087】 【表3】

表2 ノボラック樹脂(b-1)~(b-2)の合成

ノボラック 樹脂	モノマー・	モノマー 仕込み比	アルデヒド	アルデヒド 添加モル%	分子量	分別後の 分子量	分散度
b-1	m/p/2,3Xy	50/3/47	ベンズアルデヒド	10	4470	8930	2.6
b-2	m/p/2,3Xy	50/3/47	サリチルアルデヒド	10	4290	8580	2.5

#### 【0088】感光物の合成

## (7) 感光物 (S-1) の合成

表3記載の化合物(1)62.9g、1,2ーナフトキ ノンジアジドー5ースルホニルクロリド53.7g、アセトン800mLを三つロフラスコに仕込み、均一に溶解 20 した。

【0089】次いで、トリエチルアミン21. 2gを徐々に滴下し、25℃で3時間反応させた。反応混合物を1%塩酸水溶液3 L中に注ぎ、生じた沈殿を口別し、水洗、乾燥を行い感光物(S-1)を得た。

## (8) 感光物 (S-2) の合成

表3記載の化合物 (2) 53.8g、1, 2-tフトキノンジアジドー5-スルホニルクロリド53.7g、アセトン800 MLを三つロフラスコに仕込み、均一に溶解した。

【0090】次いで、トリエチルアミン21.2gを徐々に滴下し、25℃で3時間反応させた。反応混合物を1%塩酸水溶液3L中に注ぎ、生じた沈殿を口別し、水洗、乾燥を行い感光物(S-2)を得た。

# 20 (9) 感光物(S-3)の合成

表3記載の化合物 (3) 56.5g、1,2-+ フトキ ノンジアジドー5- スルホニルクロリド53.7g、アセトン800 MLを三つロフラスコに仕込み、均一に溶解した。

【0091】次いで、トリエチルアミン21.2gを徐々に滴下し、25℃で3時間反応させた。反応混合物を1%塩酸水溶液3 L中に注ぎ、生じた沈殿を口別し、水洗、乾燥を行い感光物(S-3)を得た。

[0092]

30 【表 4】

表3 感光物母核化合物

(1) HO HO Me Me OH OH Me OH OH Me OH OH Me OH OH OH Me OH

【0093】(10) ポジ型フォトレジスト組成物の調製と評価

上記(1)~(6)で得られたノボラック樹脂(a-1)~(a-11)および(b-1)~(b-4)、上記(7)~(9)で得られた感光物(S-1)~(S-3)、表 5 に示した溶剤(Y-1)~(Y-4)および表 4 に示したポリヒドロキシ化合物(P-1)~(P-3)を表 5 に示す割合で混合し、均一溶液とした後、孔

 径0.10μmのミクロフィルターを用いてろ過し、フォトレジスト組成物を調製した。このフォトレジスト組 がを、スピナーを用いてシリコンウエハー上に塗布し、真空吸着式ホットプレートで90℃、60秒間乾燥して膜厚が1.02μmのレジスト膜を得た。

[0094]

【表5】

[0095]

【表6】

表-5 ポジ型フォトレジスト組成物

$\overline{}$							1 111/20/177		
ŀ		ノボラ・	ック樹脂	感 光	: 物	ポリヒドロ	キシ化合物	滔	剤
		種類	添加量	種類	添加量	種 類	添加量	種 類	添加量
実施例	1	a-1	100	S-2	80	P-1	40	Y-2/Y-4	560/140
実施例	2	a-2	100	S-1	90	P-3	45	Y-1	745
実施例	3	a-3	100	S-3	75	P-2	35	Y-1	665
実施例	4	a-4	100	S-2	60	P-1	30	Y-2/Y-4	480/120
実施例	5	a-5	100	S-1	. 80.	P-3	40	Y-3	700
実施例	6	a-6	100	S-3	75	P-2	40	Y-1	680
実施例	7	a-7	100	S-2	75	P-1	35	Y-2/Y-4	530/135
実施例	8	a-8	100	S-1	80	P-3	40	Y-3	700
実施例	9	a-9	100	S-3	90	P-2	40	Y-1	580/150
実施例	10	a-10	100	S-2	80	P-1	40	Y-1	700
実施例	11	a-11	100	S-2	85	P-2	40	Y-2/Y-4	570/140
比較例	1	b-1	100	S-2	80	P-1	40	Y-2/Y-4	560/140
比較例	2	b-2	100	S-2	80	P-1	40	Y-2/Y-4	560/140

Y-1;エチルセロソルブアセテート

Y-2;ヒドロキシプロピオン酸エチル

Y-3;メトキシプロピオン酸エチル

Y-4;β-エトキシプロピオン酸エチル

【0096】この膜に縮小投影露光装置(ニコン社製縮小投影露光装置NSR-2005i9C)を用い露光した後、110℃で60秒間PEBを行い、2.38%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で1分間現像し、30秒間水洗して乾燥した。このようにして得

られたシリコンウエハーのレジストパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、レジストを評価した。結果を表6に示す。

[0097]

【表7】

		相対感度	解像力 µ10	デフォーカス μm	耐熱性 C	DeepUV 硬化性
実施例	1	1.3	0.28	1.7	145	0
実施例	2	1.4	0.28	1.8	145	0
実施例	3	1.4	0.28	1.9	145	0
実施例	4	1.3	0.29	1.6	145	0
実施例	5	1.4	0.30	1.6	140	0
実施例	6	1.3	0.29	1.7	145	0
実施例	7	1.3	0.30	1.6	140	0
実施例	8	1.3	0.29	1.7	145	0
実施例	9	1.5	0.30	1.6	145	0
実施例	10	1.5	0.29	1.7	145	0
実施例	11	1.4	0.28	1.9	145	0
比較例	1	1.0	0.36	1.0	135	Δ
比較例	2	1.2	0.32	1.2	135	Δ

【0098】感度は0.4μmのマスクパターンを再現 する露光量の逆数をもって定義し、比較例1の感度との 相対値で示した。解像力は Ο. 4 Ο μ m のマスクパター ンを再現する露光量における限界解像力を示す。デフォ 20 がわずかである場合。 ーカスラチチュードは実効感度において 0. 40μmの レジストパターンが膜減りなく分離する焦点の幅を走査 型電子顕微鏡で断面観察して評価した。

【0099】耐熱性は0.50 μ m のラインパターンの エッジ部が丸くなり始める温度で示した。DeepUV硬化 性は、前記方法によりシリコンウエハー上に形成された レジストパターンを、大日本スクリーン社製AEW-6 12装置を用い加熱昇温させながら(初期温度100 ℃、最終温度200℃)、遠紫外線を60秒間照射し、 その後、レジストパターンを酢酸イソアミルに1分間浸 30 漬(エッチング)し、乾燥後、走査型電子顕微鏡で観察 して評価した。表中の記号を以下に示す。

【0100】〇:レジストパターンが全くエッチングさ れず、また、パターンの変形、荒れを生じない場合(硬 化が完全)。

△:基板とレジストパターンの間にわずかにエッチング が観察された場合か、あるいは、パターンの荒れや変形

×:基板とレジストパターンの間が大きくエッチングさ れたり、あるいは、パターンの変形、荒れが大きい場

【0101】表6に示される評価結果から、本発明に係 るポジ型フォトレジストは、相対感度、解像力、デフォ 一カスラチチユード、耐熱性に優れるとともに、Dee pUV硬化性に富むことが確認された。

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 高い解像力、広いデフォーカスラチチュードを有し、得 られるレジスト像が耐熱性に優れるとともに、Deep UV硬化性に富んだポジ型フォトレジスト組成物が得 られる。